



# ウエハ自動外観検査装置 SDI - $\mu$ シリーズ

## 安価、簡易型ウエハ自動外観検査装置



CCDカメラにより、ウエハ上のゴミ、キズを検査し、良品、不良品の判別を行う装置です。

### 【装置標準仕様】

- ・ 5、6、8インチ対応(オリフラ&ノッチタイプ)
- ・ 1 カセット仕様
- ・ タッチパネルによる操作
- ・ 裏面吸着ハンド
- ・ 検出サイズ > 10  $\mu$ m
- ・ 搬送時間 25秒
- ・ 検査時間 0.2sec/1shot

検査時間はチップの大きさには依存しません。

- 例) 8.4 × 7.1mmチップ・・・98秒/8インチWafer  
5 × 5mmチップ・・・236秒/8インチWafer  
3.5 × 3.5mmチップ・・・482秒/8インチWafer

### 【オプション】

- ・ 特殊ウエハ搬送(薄型、MEMS)対応
- ・ ウエハ両面検査
- ・ HOST通信
- ・ マップデータ重ね合わせ機能
- ・ ヒストグラム機能

### 【用い】

電気 : AC100 50/60Hz 5A  
バキューム : - 40KPa 6

### 【装置寸法】

(W)490mm、(D)740mm、(H)1600mm  
重量 60kg

\* 机上への設置、また装置の移動が容易です。

\* 300mmも他の装置にて実績がございます。

### 株式会社ウインズ

【本社】

〒407-0037 山梨県韮崎市大草町若尾70  
TEL.0551-30-2050 FAX.0551-30-2051  
HP: <http://www.wins-hit.com>